

### 8.6.3 中高圧陽極用化成箔

内容	規格
公称化成電圧の範囲	$208 \leq V_{fs} \leq 664$
試験方法の呼称	Vt測定
皮膜耐電圧の記号	Vt
皮膜耐電圧 (Vt)	$V_{fs} \leq V_t$
立上がり時間 (Tr)	$Tr \leq (V_{fs} \times 0.2 + 150)$ 秒
水和処理時間	60分
水和処理後の立上がり時間 (Tr60)	$Tr_{60} \leq 150$ 秒
適用される試験方法	『中高圧陽極用化成箔の試験方法』

### 8.6.4 陰極用化成箔

内容	規格
公称化成電圧の範囲	$0.9 \leq V_{fs} \leq 3.0$
試験方法の呼称	Vt測定
皮膜耐電圧の記号	Vt
皮膜耐電圧 (Vt)	各化成電圧ごと製品カタログに記載された皮膜耐電圧に準ずる
適用される試験方法	『陰極用化成箔の試験方法』

## 8.5 外観に関する規定

項目	内容
外観	<p>一般に、エッチド箔、化成箔には原箔の状態、生産工程の違いなどにより、斑点、しわ、アルミニウム水酸化物の粉、ピンホール、色調むらなどが製品の外観にあらわれることがあります。</p> <p>下記に示す実用上差し支えないと判断される製品は合格品としています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 小さな斑点</li> <li>2) 微細なしわ、すじ</li> <li>3) アルミニウム水酸化物の粉</li> <li>4) 微小なピンホール</li> <li>5) 微小なキズ</li> <li>6) 色調むら</li> </ol> <p>もしお手元の製品について疑問をお持ちの場合は、「12.4 苦情処理」によりご連絡下さい。</p>

## 8.6 皮膜耐電圧・立上がり時間規格

### 8.6.1 極低圧陽極用化成箔

内容	規格
公称化成電圧の範囲	$3.0 \leq V_{fs} \leq 7.9$
試験方法の呼称	V <sub>t</sub> 測定
皮膜耐電圧の記号	V <sub>t</sub>
皮膜耐電圧 (V <sub>t</sub> )	$V_{fs} \leq V_t$
立上がり時間 (Tr)	$Tr \leq (V_{fs} \times 0.5 + 100)$ 秒
水和処理時間	60分
水和処理後の立上がり時間 (Tr <sub>60</sub> )	$Tr_{60} \leq 150$ 秒
適用される試験方法	『極低圧陽極用化成箔の試験方法』

### 8.6.2 低圧陽極用化成箔

内容	規格
公称化成電圧の範囲	$8.0 \leq V_{fs} \leq 170$
試験方法の呼称	V <sub>t</sub> 測定
皮膜耐電圧の記号	V <sub>t</sub>
皮膜耐電圧 (V <sub>t</sub> )	$V_{fs} \leq V_t$
立上がり時間 (Tr)	$Tr \leq (V_{fs} \times 0.5 + 100)$ 秒
水和処理時間	60分
水和処理後の立上がり時間 (Tr <sub>60</sub> )	$Tr_{60} \leq 150$ 秒
適用される試験方法	『低圧陽極用化成箔の試験方法』

## 8. 製品規格

### 8.1 陽極箔の静電容量規格

項目	内容
幅の保証範囲	① U147・U140 化成箔 :485mm幅の両端からそれぞれ2.5mmを除いた480mm幅 エッチド箔:500mm幅の両端からそれぞれ 10mmを除いた480mm幅  ② U199-50.2Vfs以上・U191-45.6Vfs以上 :500mm幅の両端からそれぞれ 12.5mmを除いた475mm幅  ③ その他の全製品 化成箔、エッチド箔 :500mm幅の両端からそれぞれ 10mmを除いた480mm幅
平均容量値(X)	「製品一覧表」に記載された静電容量値
平均容量値(X)の範囲	「製品一覧表」に記載された容量許容差
平均容量値(X)の算出	巻外側(Outer Side)の測定容量値をA1,A2,A3とし、 巻芯側(Core Side)の測定容量値をB1,B2,B3とした際、 下の計算式による  $\bar{X} = (A \max + A \min + B \max + B \min) \div 4$
バラツキ率	13%以下
バラツキ率の算出	巻外側(Outer Side)の測定容量値をA1,A2,A3とし、 巻芯側(Core Side)の測定容量値をB1,B2,B3とした際、 下の計算式による  $\text{バラツキ率} = \frac{A \max \text{ or } B \max - A \min \text{ or } B \min}{\text{平均容量値}} \times 100(\%)$
適用される試験方法	1.『極低圧陽極用化成箔の試験方法』 2.『低圧陽極用化成箔の試験方法』 3.『低圧陽極用エッチド箔の静電容量試験方法』 4.『中高圧陽極用化成箔の試験方法』 5.『中高圧陽極用エッチド箔の静電容量試験方法』

※ 詳しい各試験方法につきましては、KDK販売ホームページ「お問い合わせ」よりご連絡ください

## 8.2 陰極箔の静電容量規格

項目	内容
幅の保証範囲	500mm幅の両端からそれぞれ10mmを除いた480mm幅
容量値の範囲	「製品一覧表」に記載された静電容量値の範囲内
容量値の算出	巻外側(Outer Side)の静電容量値をAとし巻芯側(Core Side)の静電容量値をBとした際の最低値
水和処理時間	60分
水和処理後の静電容量の変化率	$\Delta C_{60} \geq -10\%$
適用される試験方法	『陰極用エッチド箔の静電容量試験方法』 『陰極用化成箔の試験方法』

注)水和処理後の静電容量の変化率 ( $\Delta C_{60}$ ) はC518・C519・C439・C531エッチド箔のみに適用されます。その他の陰極用エッチド箔および陰極用化成箔には適用されません。

## 8.3 公称化成電圧の範囲

〈化成箔の種類〉と〈公称化成電圧の範囲〉の関係は以下のとおりです。

化成箔の種類	公称化成電圧の範囲
極低圧陽極用化成箔	$3.0 \leq V_{fs} \leq 7.9$
低圧陽極用化成箔	$8.0 \leq V_{fs} \leq 170$
中高圧陽極用化成箔	$208 \leq V_{fs} \leq 664$
陰極用化成箔	$0.9 \leq V_{fs} \leq 3.0$

## 8.4 残留塩素濃度規格

項目	内容	
残留塩素濃度	低圧陽極用エッチド箔	2.0mg/m <sup>2</sup> 以下
	低圧陽極用化成箔、陰極用化成箔	0.8mg/m <sup>2</sup> 以下
	中高圧陽極用エッチド箔、中高圧陽極用化成箔 陰極用エッチド箔	1.0mg/m <sup>2</sup> 以下
適用される試験方法	『陽極用化成箔の残留塩素濃度の試験方法』 『エッチド箔および陰極用化成箔の残留塩素濃度の試験方法』	